

國立交通大學  
電子工程學系 電子研究所  
博士論文

動態臨界電壓金氧半電晶體之特性  
及可靠度研究

**A Study on the Characteristics and  
Reliability of Dynamic Threshold MOSFETs**



研究生： 李耀仁

指導教授： 黃調元 博士

趙天生 博士

中華民國九十三年十月